

<<可靠性试验>>

图书基本信息

书名：<<可靠性试验>>

13位ISBN编号：9787121002106

10位ISBN编号：7121002108

出版时间：2004-8-1

出版时间：电子工业出版社

作者：刘明治

页数：332

字数：482000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<可靠性试验>>

内容概要

本书是“电子元器件质量与可靠性技术”丛书之一。

本书在介绍电子元器件可靠性的必要性及基本概念的基础上，详细介绍了电子元器件的主要可靠性试验和通用的基本可靠性试验的原理、常用设备及操作程序，进而介绍了电子元器件可靠性试验的设计及技术问题。

目的在于提高电子元器件可靠性试验的水平及技术。

本书为电子元器件质量与可靠性技术培训教材，对从事质量与可靠性工作的技术人员和管理人员是一本实用的参考书。

<<可靠性试验>>

书籍目录

第1章 概论 1.1 电子元器件 1.2 电子元器件的可靠性 1.3 影响电子元器件可靠性的因素 1.4 电子元器件可靠性试验的定义与原理 1.4.1 可靠性试验的定义 1.4.2 可靠性试验的原理 1.5 电子元器件可靠性试验的分类及内涵 1.5.1 可靠性试验的分类 1.5.2 可靠性增长试验和失效分析试验 1.5.3 老炼试验和筛选试验 1.5.4 模拟试验和现场试验 1.5.5 例行试验、质量一致性检验和可靠性验收试验 1.5.6 可靠性鉴定试验、可靠性定级试验和可靠性维持试验 1.6 可靠性试验在可靠性工程中的地位 复习与思考题

第2章 电子元器件的可靠性试验 2.1 电子元器件的可靠性试验概述 2.2 电子元器件的失效率试验 2.3 电子元器件的寿命试验 2.4 电子元器件的可靠性增长试验方法 2.5 电子元器件的可靠性筛选 2.6 电子元器件的其他可靠性试验 2.7 电子设备的可靠性试验 复习与思考题

第3章 电子元器件的可靠性基础试验 3.1 概述 3.2 机械\环境试验 3.3 电子元器件的电性能特性能数检测试验 3.4 电子元器件可靠性试验的常用设备 复习与思考题

第4章 电子元器件的可靠性试验设计 4.1 可靠性试验的一般要求 4.2 试验条件选择及试验周期设计 4.3 可靠性试验报告 4.4 现场可靠性试验 4.5 可靠性试验技术与管理 复习与思考题

结束语主要参考文献

<<可靠性试验>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>